



Rundschalttisch für Leiterplattenprüfung

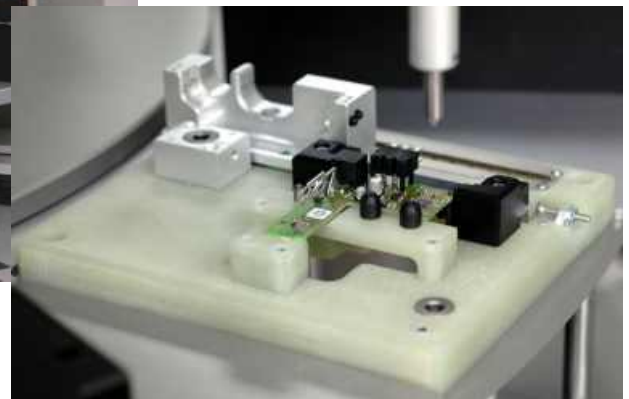
Prüfautomat für EOS Fensterheber mit wechselbaren
Warenträgern und Wechselsätzen für verschiedene Platinen.
Elektrischer Rundschalttisch mit 8er Teilung.

Umrüstbar für verschiedenste Produkte ähnlicher Größe
je nach Kundenanforderung.





Allgemeine Merkmale



- Das System ist modular aufgebaut.
- Die Warenträger sind fest auf dem Rundtisch fixiert.
- Alle Warenträger und Wechselsätze sind codiert und können so durch das jeweilige Prüfprogramm auf ihr korrektes Vorhandensein abgefragt werden.
- Wechselsätze sind schwimmend gelagert und werden auf den Warenträger zentriert. Dies ermöglicht den Ausgleich von Toleranzen und eine hochgenaue Kontaktierung.
- Die Anlage ist mit dem Firmennetzwerk verknüpft.
- Die Messdaten werden entsprechend dem Produkt-Barcode in die Datenbank übergeben, um eine Qualitätsauswertung bzw. Traceability zu ermöglichen.
- Einfache Bedienung durch Start-Taster.
- Optische IO/NIO-Anzeige.
- Sicherheits-Lichtgitter als Eingreifschutz für die Bedienperson.
- Seitlich angebrachte kundenspezifische Schnittstelle zum Testsystem, die variabel an das Testsystem angepasst werden kann.



Realisierung

Station 1: Einlege- und Entnahmestation

- Manuelle NIO-Entnahme von Platine oder Deckel und Ablegen in überwachte NIO-Schublade (Kosteneinsparung durch getrennte NIO-Entnahme, IO-Teile können wieder verwendet werden)
- Manuelles Einlegen von Prüflingsteilen mit Identifikation des Warenträgers
- Anordnung vom Monitor im Sichtbereich des Bedieners
- Unterbringung von Tastatur und Monitor in Tastaturschublade ermöglicht schnelle Bedienung des Testsystems durch den Einrichter

Station 2: Kontrolle durch Maske auf Motorkontakte

- Die Identifikation der Produktvariante über Data-Matrix-Code gewährleistet eine vollständige Traceability der Prüflinge
- Sensorik zur Abfrage der Deckeldichtung
- Sensorik zur Erkennung der Deckelkodierung
- Mechanische Prüfung der Motorkontakte

Station 3: In-Circuit-Test

- Beidseitige Kontaktierung der Platine für ICT-Prüfung
- Abfrage der Lötverbindung des ICs durch Open-Check

Station 4: PIC-Programmierung

- Niederhalten der Leiterplatte mit Kontaktierung von unten
- Flashen des Micro-Controllers
- Verify des Flashvorgangs

Station 5: Leerstation (Reserve)

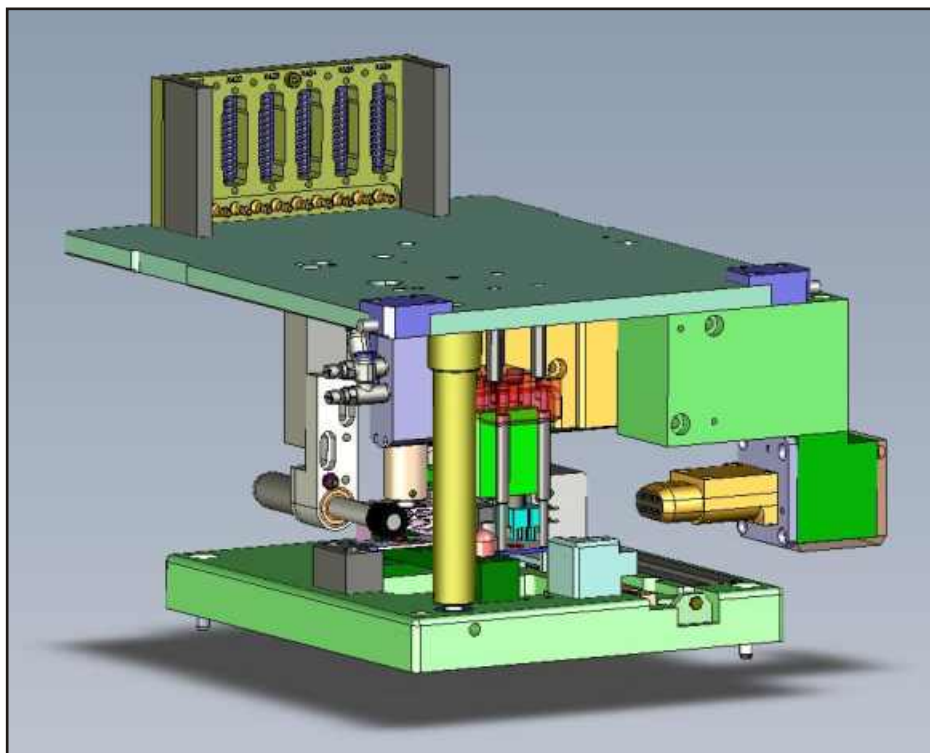
- Kann jederzeit nachgerüstet werden für Zusatzprodukte je nach Kundenanforderung





Station 6: Funktionsprüfung (FKT)

- Beidseitige Kontaktierung der Leiterplatte für Funktionsprüfung (FKT)
- Erregung des Hall-Sensors durch einen elektrisch angetriebenen Rund-Permanent-Magnet
- Kontaktierung der Anschlusspins mit verschleißfesten Kontaktzungen



Station 7: Verrasten von Deckel mit Platine

- Kontrolle der Verklipsnasen auf Vorhandensein und Verrastung
- Kennzeichnung der IO-Prüflinge mit Ritz-Markierer

Station 8: Leerstation

- Kann jederzeit nachgerüstet werden, z.B. für Roboterhandlung zur automatischen Entnahme, um Teilevermischung von guten und schlechten Teilen zu verhindern.